

DIN 51179

ICS 25.220.50

Ersatz für
DIN 51179:2014-09

**Emails und Emaillierungen –
Niederspannungsprüfung zum Nachweis und zur Lokalisierung von
Fehlstellen auf profilierten Oberflächen –
Schlickermethode**

Vitreous and porcelain enamels –
Low-voltage test for detecting and locating defects on profiled surfaces –
Slurry test

Emaux vitrifiés –
Essai à basse tension pour la détection et la localisation des défauts sur des surfaces
profilées –
Méthode barbotine

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Prüfmedium	4
6 Geräte	5
6.1 Spannungsquelle	5
6.2 Prüfelektrode	5
7 Proben	5
8 Durchführung	6
9 Angabe der Ergebnisse	6
10 Prüfbericht	6
Literaturhinweise	8

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-01-63 AA „Prüfung von Emails und Emailierungen“ des DIN-Normenausschusses Materialprüfung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 51179:2014-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Metallbesenelektrode als Prüfelektrode präzisiert.

Frühere Ausgaben

DIN 51179: 2014-09